



(12)

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(21) Anmeldenummer: 88100792.6

(51) Int. Cl. 4: **H01L 25/04**, **H01L 23/56**,
H01L 23/52

(22) Anmeldetag: 20.01.88

(30) Priorität: 21.01.87 DE 3701650

(43) Veröffentlichungstag der Anmeldung:
10.08.88 Patentblatt 88/32

(84) Benannte Vertragsstaaten:
CH DE FR GB IT LI

(71) Anmelder: **Siemens Aktiengesellschaft Berlin und München**
Wittelsbacherplatz 2
D-8000 München 2(DE)

(72) Erfinder: **Amann, Heinz**
Fasanenstrasse 100
D-8025 Unterhaching(DE)
Erfinder: **Lorenz, Leo, Dr.-Ing.**
Max-Lörr-Strasse 14
D-8014 Neubiberg(DE)

(54) Halbleiteranordnung mit mindestens einem Halbleiterkörper.

(57) Bei einer Halbleiteranordnung mit mindestens einem auf einem isolierenden, mit Leiterbahnen (2, 3, 4, 5) versehenen Substrat (1) angeordneten Halbleiterkörper (6) läßt sich ein induktivitätsarmer Aufbau dadurch erreichen, daß die Anschlußleiter (11, 12) dicht beieinander und wenigstens teilweise parallel zueinander angeordnet sind.

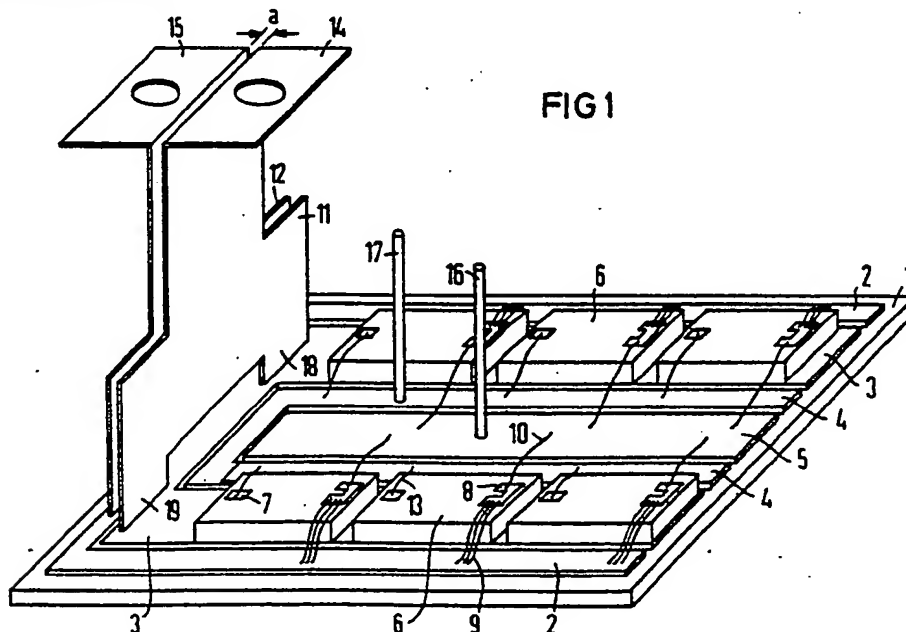


FIG 1

EP 0 277 546 A1

Halbleiteranordnung mit mindestens einem Halbleiterkörper

Die Erfindung bezieht sich auf eine Halbleiteranordnung mit einem isolierenden Substrat, mit mindestens zwei auf dem Substrat angeordneten, elektrisch voneinander getrennten Leiterbahnen, mit mindestens einem mit Kontakten versehenen Halbleiterkörper, mit elektrischen Verbindungen zwischen den Kontakten und den Leiterbahnen, mit Anschlußleitern, von denen je einer elektrisch mit einer der beiden Leiterbahnen verbunden ist.

Eine Halbleiteranordnung der beschriebenen Art ist Gegenstand der älteren deutschen Patentanmeldung P 36 35 956.4. Ein Ausführungsbeispiel zeigt, daß die den Laststrom führenden Anschlußleiter an einander entgegengesetzten Enden des Substrats angeordnet sind. Damit bilden sie eine relativ hohe Induktivität im Lastkreis, wodurch beim Abschalten der Halbleiteranordnung mit hoher Steilheit des Laststroms eine hohe Spannung induziert wird, die zur Zerstörung der Halbleiterbauelemente führen kann.

Ziel der vorliegenden Erfindung ist es, die Induktivität des Hauptstromkreises zu verringern.

Dies wird dadurch erreicht, daß die Anschlußleiter dicht beieinander und zumindest teilweise parallel zueinander angeordnet sind.

Weiterbildungen der Erfindung sind Gegenstand der Unteransprüche.

Die Erfindung wird anhand zweier Ausführungsbeispiele in Verbindung mit den Figuren 1 und 2 näher erläutert. Es zeigen:

Figur 1 eine perspektivische Ansicht eines ersten Ausführungsbeispiels und

Figur 2 die Aufsicht auf ein zweites Ausführungsbeispiel.

Die Halbleiteranordnung nach Figur 1 ist auf einem Substrat 1 aufgebaut. Das Substrat besteht aus einem gut isolierenden und thermisch gut leitenden Werkstoff wie z. B. Aluminiumoxid oder Berylliumoxid. Auf dem Substrat sind Leiterbahnen 2, 3, 4 und 5 angeordnet. Die Leiterbahnen 2 und 3 sind U-förmig ausgebildet; beide Leiterbahnen sind ineinander verschachtelt. Auf der Leiterbahn 3 sind Halbleiterkörper 6 angeordnet und mit den Leiterbahnen stromleitend verbunden. Die Halbleiterkörper können beispielsweise Leistungs-MOSFET's oder auch Bipolartransistoren sein. Im vorliegenden Fall wird davon ausgegangen, daß die Halbleiterkörper MOSFET's sind. Sie weisen auf der der Leiterbahn 3 abgekehrten Seite Gatekontakte 7 und Sourcekontakte 8 auf. Der Drainkontakt liegt auf der unteren Seite und ist mit der Leiterbahn 3 verbunden. Die Sourcekontakte 7 sind mit der Leiterbahn 4 über Bonddrähte 13 verbunden. Die

Sourcekontakte 8 stehen mit der Leiterbahn 2 über Bonddrähte 9 in Verbindung. Die Sourcekontakte 8 sind außerdem über Bonddrähte 10 mit der vierten Leiterbahn 5 verbunden.

Die Leiterbahnen 2 und 3 sind aus Gründen einer möglichst geringen Induktivität im Lastkreis nahe beieinander angeordnet. Ihr Abstand ist aber so bemessen, daß die geforderte elektrische Spannungsfestigkeit gewährleistet ist. Die Leiterbahnen 2 und 3 liegen außerdem einander parallel. An den ebenfalls einander parallelliegenden Jochen der beiden U-förmigen Leiterbahnen 2 und 3 ist je ein Anschlußleiter 11 bzw. 12 angebracht, z. B. angelötet. Die Anschlußleiter 11, 12 sind einander bis auf ihre zum Anschluß an eine äußere Leitung bestimmte Flächen 14, 15 parallel. Ihr Abstand a ist ebenso wie der Abstand zwischen den beiden Leiterbahnen 2 und 3 möglichst gering gewählt derart, daß die elektrische Spannungsfestigkeit noch gewährleistet ist.

Durch den beschriebenen Aufbau läßt sich die Induktivität des Hauptstromkreises gegenüber der eingangs erwähnten Halbleiteranordnung etwa halbieren. Damit wird auch die beim Abschalten des Stroms auftretende induktive Spannung halbiert.

Die Leiterbahnen 4 und 5 sind mit einem Gateanschluß 17 bzw. einem Source-Hilfsanschluß 16 verbunden. Die MOSFET werden durch eine zwischen die Anschlüsse 16 und 17 angelegte Spannung gesteuert. Der Steuerkreis ist somit induktiv weitgehend vom Laststromkreis entkoppelt, so daß der Laststromanstieg nur geringen Einfluß auf das Einschaltverhalten der Halbleiteranordnung hat.

Die trotz des geringen Abstandes a zwischen den Anschlußleitern 11, 12 bestehende Induktivität kann dadurch teilweise kompensiert werden, daß der Zwischenraum zwischen den Anschlußleitern mit einem Dielektrikum gefüllt wird, dessen relative Dielektrizitätskonstante größer als 1 ist. Hier können die für Kondensatoren verwendbaren Materialien Verwendung finden. Zusätzlich oder ausschließlich kann eine Isolierstoffolie zwischen den beiden Anschlußleitern angeordnet sein.

Es empfiehlt sich aus Gründen einer geringen Induktivität, die Anschlußleiter möglichst kurz zu halten. Sie stehen daher vorzugsweise senkrecht zur Oberfläche des Substrats 1.

Weist die Halbleiteranordnung mehrere Halbleiterkörper auf, so können die Anschlußleiter 11, 12, wie in Figur 2 dargestellt symmetrisch auf dem Substrat 1 und den Leiterbahnen 2, 3 angeordnet sein. Im Ausführungsbeispiel nach Figur 2 sind die Leiterbahnen 2, 3 in sich geschlossene Ringe, die jeweils zu einer Symmetrieachse

spiegelsymmetrisch ausgebildet sind. Ebenso sind die Halbleiterkörper 6 symmetrisch zur Symmetrieachse 22 auf der Leiterbahn 3 verteilt. Die Anschlußleiter 11, 12 sind beidseitig der Symmetrieachse angeordnet. Zur Vermeidung von Kurzschlüssen haben die Anschlußleitern 11, 12 Füße 18, 19 bzw. 20, 21. Die Halbleiterkörper 6 können bezüglich der Lage der Kontakte 7 und 8 ebenfalls symmetrisch zur Symmetrieachse 22 auf der Leiterbahn 3 angeordnet sein.

5

10

Ansprüche

1. Halbleiteranordnung mit einem isolierenden Substrat,

15

mit mindestens zwei auf dem Substrat angeordneten, elektrisch voneinander getrennten Leiterbahnen, mit mindestens einem mit Kontakten versehenen Halbleiterkörper,

20

mit elektrischen Verbindungen zwischen den Kontakten und den Leiterbahnen,

mit Anschlußleitern, von denen je einer elektrisch mit einer der beiden Leiterbahnen verbunden ist, **dadurch gekennzeichnet,**

25

daß die Anschlußleiter (11, 12) dicht beieinander und zumindest teilweise parallel zueinander angeordnet sind.

2. Halbleiteranordnung nach Anspruch 1, **dadurch gekennzeichnet,**

30

daß die beiden Leiterbahnen (2, 3) auf ein- und derselben Oberfläche des Substrats (1) angeordnet sind, daß sie einander parallel liegen, daß die Anschlußleiter an einander benachbarten, parallel liegenden Abschnitten der Leiterbahnen befestigt sind und daß die Anschlußleiter rechtwinklig auf der Substratoberfläche stehen.

35

3. Halbleiteranordnung nach Anspruch 1 oder 2,

dadurch gekennzeichnet,

40

daß die erste (2) und die zweite Leiterbahn (3) jeweils spiegelsymmetrisch ausgebildet sind, daß die Halbleiterkörper (6) symmetrisch verteilt auf der zweiten Leiterbahn (3) angeordnet sind und daß die Anschlußleiter (11, 12) zu beiden Seiten der Symmetrieachse (22) mit den entsprechenden Leiterbahnen verbunden sind.

45

4. Halbleiteranordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 3,

dadurch gekennzeichnet,

50

daß der Raum zwischen beiden Anschlußleitern mit einem Dielektrikum gefüllt ist, das eine relative Dielektrizitätskonstante größer als 1 hat.

5. Halbleiteranordnung nach Anspruch 4,

dadurch gekennzeichnet,

55

daß zwischen beiden Anschlußleitern (11, 12) eine Isolierstoffolie angeordnet ist.

FIG1

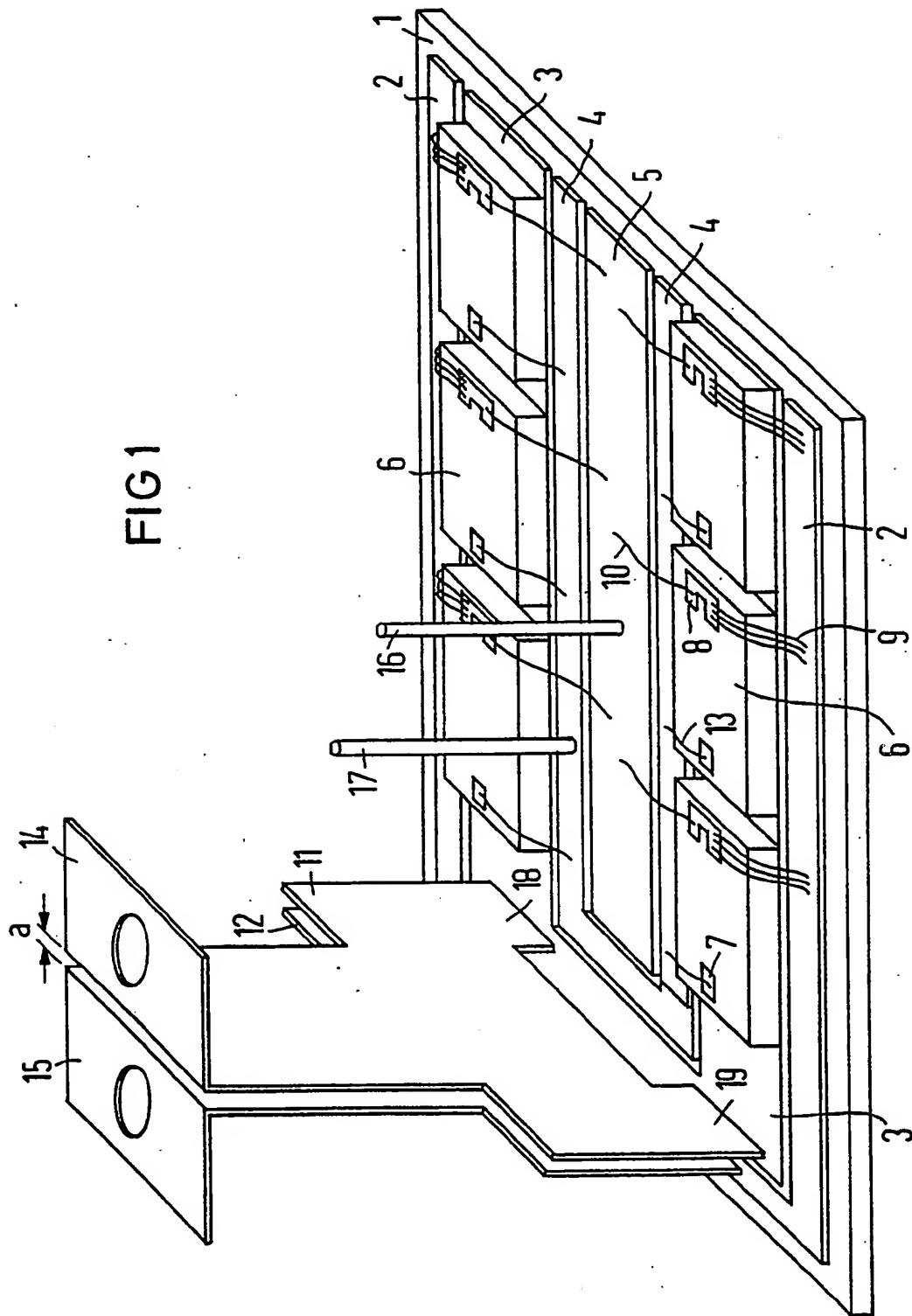
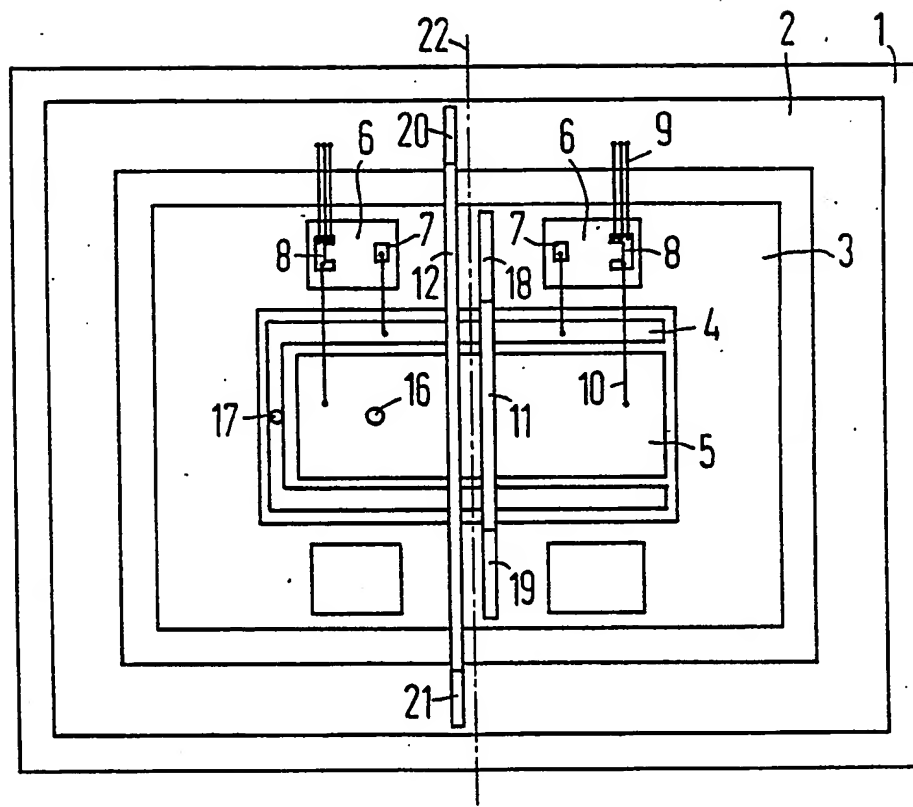


FIG 2





EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int. CL.4)
X	EP-A-0 042 987 (IBM) * Figur 1; Patentansprüche 1,7 *	1	H 01 L 25/04
A	---	2-5	H 01 L 23/56 H 01 L 23/52
X	US-A-4 237 522 (IBM) * Figur 1; Patentansprüche 1,7 *	1	
A	---	2-5	
A	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, Band 9, Nr. 212 (E-339)[1935], 29. August 1985; & JP-A-60 74 557 (FUJITSU K.K.) 26.04.1985	1-5	
A	---		
A	DE-A-3 516 995 (MITSUBISHI)		
P, X	EP-A-0 221 399 (BBC) * Figuren 1,2; Patentansprüche 1,4 *	1	

Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt			RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (Int. CL.4)
			H 01 L
Recherchenort		Abschlußdatum der Recherche	Prüfer
DEN HAAG		25-04-1988	DE RAEVE R.A.L.
KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE			
X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie A : technologischer Hintergrund O : mündliche Offenbarung P : Zwischenliteratur		T : der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze E : älteres Patentedokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist D : in der Anmeldung angeführtes Dokument L : aus andern Gründen angeführtes Dokument ----- & : Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument	

This Page is inserted by IFW Indexing and Scanning
Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

- ☒ BLACK BORDERS
- ☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- ☐ FADED TEXT OR DRAWING
- ☐ BLURED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
- ☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
- ☐ COLORED OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
- ☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
- ☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
- ☐ REPERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
- ☐ OTHER: _____

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

**As rescanning documents *will not* correct images
problems checked, please do not report the
problems to the IFW Image Problem Mailbox**